

Wizyta kierownictwa Litewskiej Inspekcji Metrologicznej w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniu 18 lipca br. GUM odwiedzili przedstawiciele Litewskiej Inspekcji Metrologicznej: jej szef p. Vaidas Gricius oraz zastępca, p. Rimantas Sanajevas. Goście spotkali się m.in. z Prezesem GUM, prof. Jackiem Semaniakiem oraz przedstawicielami Departamentów: Certyfikacji (p. Paulina Olszewska), Nadzoru i Kontroli (p. Konrad Stolarski), jak również Współpracy Międzynarodowej (p. Marcin Mikiel, p. Joanna Bukiel). W trakcie spotkania omówiono strukturę i główne zadania Departamentu Certyfikacji.

Przedstawiono również procesy certyfikacyjne realizowane w Głównym Urzędzie Miar oraz wyzwania w obszarze metrologii prawnej. Ponadto, goście zapoznali się z systemem administracji miar w Polsce oraz ustawami, których przestrzeganie nadzoruje Departament Nadzoru i Kontroli GUM (ustawa Prawo o miarach, Prawo probiercze, Ustawa o tachografach, Ustawa o towarach paczkowanych, Ustawa o systemie zgodności i nadzorze rynku).

Po zapoznaniu się z prezentacjami oraz krótkiej dyskusji prof. Semaniak oraz p. Vaidas Gricius podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.

W drugiej części wizyty przedstawiciele Litewskiej Inspekcji Metrologicznej zwiedzili Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny GUM, gdzie zapoznali się z procesem budowy kampusu, planowanym wyposażeniem i realizowanymi usługami.

Dziękując za możliwość spotkania i podpisanie porozumienia goście z Litwy wyrazili nadzieję na zacieśnienie współpracy dla obopólnej korzyści oraz

wystosowali zaproszenie do odwiedzenia Litewskiej Inspekcji Metrologicznej.

